



L'accréditation : un axe fort du CIM 2017

**Le Congrès International de Métrologie aura lieu du 19 au 21 septembre 2017 (CIM 2017)
à Paris, Porte de Versailles avec le Salon ENOVA**

Le CIM est un événement unique à la croisée des chemins entre applications industrielles et R&D pour tout public et tout secteur : utilisateurs industriels de moyens de mesure, experts techniques, laboratoires publics et privés, fabricants et prestataires.

Il permet :

- d'améliorer ses **processus de mesure, d'analyses et d'essais** et mieux maîtriser leurs risques,
- de suivre **les évolutions des techniques de mesure**, les avancées R&D et leurs implications industrielles.

Trois moments clés sur les sujets accréditation sont à citer plus particulièrement :

- Une session « **Métrologie dans les laboratoires médicaux** »
- Une conférence « **Métrologie au service de la protection des particuliers et des travailleurs dans le domaine des rayonnements** » présentée par le Cofrac
- Une table ronde « **Déclaration de conformité : nouvelle ISO 17025** »

Attendue cette année, la nouvelle version de la norme ISO/IEC 17025 doit corriger les lacunes de la version actuelle. L'une des modifications majeure concerne les **incertitudes de mesure** et leur utilisation pour **prononcer la conformité**. Les questions abordées : quels sont les changements en métrologie ? Les nouvelles règles de décision pour **déclarer la conformité** ? Comment mettre en place **l'approche risque** ?

Les intervenants de EA, du Cetiati, du Cofrac, du LNE, de PSA Group et de l'Ukas seront là pour répondre.

Egalement **5 autres tables rondes industrielles** :

- La métrologie pour l'industrie pharmaceutique
- Quelle mesure pour la qualité de l'eau ?
- Mesure dynamique et usine du futur
- Drone et surveillance
- Quel progrès en mesure à l'échelle nano ?

Et aussi près de 180 conférences sur :

- . les processus : incertitudes de mesure, modèles mathématiques, formation, métrologie dans les laboratoires médicaux ...
- . les techniques : débit, électricité, température, dimensionnel et 3D, optique ...
- . les perspectives : énergie, intelligence artificielle et data, évolution du SI, nanotechnologies, métrologie 4.0 ...

Pour compléter ce panel des **visites techniques** à l'Observatoire de Paris, chez DOSEO et une démonstration de drone en situation de mesure.

Le Congrès est organisé par le Collège Français de Métrologie en partenariat avec Euramet, European co-operation for Accreditation, le BIPM, l'OIML, le NCSLI, le NPL, et le SPF Economie pour la participation internationale. Des utilisateurs, des professionnels et des universitaires complètent l'organisation : A3P, Afnor Normalisation, BEA Métrologie, CETIAT, Cofrac, Hexagon Manufacturing Intelligence, Implex, LNE, Métro-Logix, PSA Group, Rolls Royce, Trescal, STIL, l'Université de Bourgogne et Wika.

Le partenaire Platine du CIM 2017 est **TRESCAL**.

Les autres sponsors du congrès sont : le **CETIAT**, **Hexagon Manufacturing Intelligence**, **Implex** et **Polyworks Europa**. La DGE, direction du Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère de la Culture soutiennent également l'organisation.

Le CIM 2017 est organisé conjointement avec ENOVA, le salon des technologies Electronique, IoT, Mesure, Vision et Optique.

Les temps forts du CIM 2017

- Une animation quotidienne sur le **Village Métrologie, l'exposition liée au CIM**, où se retrouvent les visiteurs du salon, les exposants qui souhaitent se rapprocher du Congrès et les participants inscrits au CIM

Le Village Métrologie au début avril compte déjà plus d'exposants que pour l'édition précédente :

A+ METROLOGIE, ACALIME, AFNOR GROUP, AEROMETROLOGIE, AMETEK, AUTOMATED PRECISION EUROPE, BEA METROLOGIE, BEAMEX, BRONKHORST France, BRUKER, CARB & DIAM et DINO-LITE, CETIAT, CETIM, COFRAC, CZECH METROLOGY INSTITUTE, DELTA MU, DIMELCO, E+E ELEKTRONIK, E2M, ELEXIENCE, EOTECH, EURAMET, EURO THERM AUTOMATION, FELIX INFORMATIQUE, FENSOR, FURNESS CONTROLS, GE MEASUREMENT & CONTROL, GUILDLINE INSTRUMENTS, HBM, HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE, IMPLEX, INSAVALOR, INSIDIX, JRI, KAMBIC, KIMO INSTRUMENTS, KREON TECHNOLOGIE, LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS, MANUMESURE, MBW CALIBRATION, MEATEST, MB ELECTRONIQUE, MESCOAN, METROLOGIC GROUP, METTLER TOLEDO, MICRO EPSILON France, MI-EUROPE, MITUTOYO, NIKON METROLOGY, NPL, OLYMPUS, OROS, PCB PIEZOTRONICS, POLYWORKS EUROPA, PRESYS INSTRUMENTS, RADWAG BALANCES & SCALES, SCAIME, SEMATEC, STIL, SIKA France, SPF Economie, TESTO INDUSTRIAL SERVICES, TRESCAL, TUBITAK, WIKA INSTRUMENTS, WIMESURE, WERTH MESSTECHNIK France

- La conférence plénière du 20 septembre « **Mesurer pour inventer le futur** » avec des interventions des plus **grands organismes mondiaux de métrologie** sur la révision du SI annoncée pour 2018 et la R&D métrologie au niveau européen
- L'intervention de **Madame Sautter du Muséum National d'Histoire Naturelle**, minéralogiste et impliquée dans l'instrumentation du Rover Curiosity travaillant sur Mars (awards collectif 2014 de la NASA et médaille d'argent 2016 du CNRS), lors de la session de clôture du jeudi 21 septembre après-midi

Participer au CIM c'est ...

... rencontrer les « bonnes » personnes qui vont **conduire plus rapidement aux « bonnes » solutions**,
... nouer une vraie **relation professionnelle avec des homologues**,
... comprendre **l'apport décisionnel de la métrologie dans les processus industriels**,
... **découvrir les technologies et les solutions** pour notre quotidien et pour demain.

Le programme complet et l'inscription en ligne sont accessibles sur le site www.cim2017.com

Information presse :

Secrétariat Général du Collège Français de Métrologie

04.67.06.20.36 - info@cfmetrologie.com - www.cim2017.com